S4 1 PN="24262" ?t 4/5/1

4/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04652362 **Image available**
IMAGE PICKUP OPTICAL SYSTEM

PUB. NO.: 06-324262 [**JP 6324262** A] PUBLISHED: November 25, 1994 (19941125)

INVENTOR(s): GOTO HISASHI

APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 05-132446 [JP 93132446] FILED: May 11, 1993 (19930511) INTL CLASS: [5] G02B-013/00; G02B-027/42

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide an image pickup optical system in which various aberrations, specially chromatic aberration are excellently compensated by constituting the optical system combining a diffraction type optical element with a refraction type optical element.

CONSTITUTION: This system is composed of at least one diffraction type optical element having a positive refractive power, at least one refraction type optical element having a positive refractive power and at least one refraction type optical element having a negative refractive power, r(sub 1)-r(sub 14) represent the radii of curvature of respective surfaces and d(sub 1)-d(sub 13) represent the intervals between the respective surfaces. At least one refraction type optical element having a positive refractive power and at least one refraction type optical element having a negative refractive power mainly compensate the convergence of a light spot, the curvature of field and the distortion aberration, etc. By adding the diffraction type optical element having a positive refractive power to them, the chromatic aberration over wide wavelength regions is compensated.

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-234262

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 4 1 K	1/02	· C	6863-2C		
		В	6863-2C		
B 4 1 C	1/04		8808-2H		
B41K	1/00	С	6863-2C		

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号 特願平5-21205

(22)出願日 平成5年(1993)2月9日 (71)出顧人 000005957

三菱鉛筆株式会社

東京都品川区東大井5丁目23番37号

(72)発明者 佐々木 繁弘

神奈川県横浜市神奈川区入江二丁目5番12

号 三菱鉛筆株式会社研究開発センター内

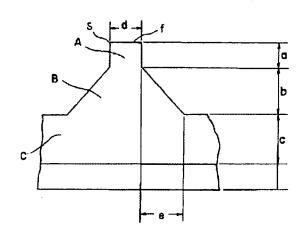
(74)代理人 弁理士 藤本 博光 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ゴム印字体の刻印形状

(57)【要約】

【構成】 レーザービームで形成されたゴム印判であっ て、印判断面形状が(A)印面の紋様幅(d)と同一の 断面幅を有する印面紋様保持部分、(B)該(A)印面 紋様保持部分を支える印面台形部分、および(C)印判 基底部分、からなり、該(B)部分のショルダーはスロ ープ状であり、そのペースの広がり (e) がレーザービ ームの走査送りピッチの30倍以内であり、印上面から の浮き彫り深さ(a)と総彫り込み深さ(a+b)との 比率が、1:99~99:1であり、印料基底部分の厚 み (c) は、印材幅 (a+b+c) の20~90%であ ることを特徴とするレーザービームで形成されたゴム印 判。

【効果】 本発明の印判の断面は矩形であり、印面かど 湾曲部分gの深さが0に近いため、従来より少ない加圧 で捺印できる。またインキ消費量が少なく、一度のイン キ付着で数多くの捺印が可能である。また捺印された紋 様幅のばらつきが少ない。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザーピームで形成されたゴム印判で あって、印判断面形状が(A) 印面の紋様幅(d) と同 一の断面幅を有する印面紋様保持部分、(B) 該(A) 印面紋様保持部分を支える印面台形部分、および(C) 印判基底部分、からなり、該(B)部分のショルダーは スロープ状であり、そのペースの広がり (e) がレーザ ーピームの走査送りピッチの30倍以内であり、印上面 からの浮き彫り深さ(a)と総彫り込み深さ(a+b) との比率が、 $1:99\sim99:1$ であり、印判基底部分 10 が左右の力に対して応力が集中し取扱い時に欠け易い欠 の厚み (c) は、印材幅 (a+b+c) の20~90% であることを特徴とするレーザーピームで形成されたゴ ム印判。

【請求項2】(A)印面の紋様幅(d)と同一の断面幅 を有する印面紋様保持部分、(B) 該(A) 印面紋様保 持部分を支える印面台形部分、および(C)印料基底部 分、からなる断面形状を有し、印面かど湾曲部分(s) の深さが0に近く、該(B)部分のショルダーはスロー ブ状であり、そのベースの広がり (e) がレーザービー 浮き彫り深さ(a)と総彫り込み深さ(a+b)との比 率が、1:99~99:1であり、印判基底部分の厚み (c) は、印材幅 (a+b+c) の20~90%である ことを特徴とするレーザービームで形成されたゴム印の 刻印形状。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ゴム印制およびゴム印 字体の刻印形状に関する。詳しくは、レーザー加工によ るゴム印判とその刻印形状に関する。

[0002]

【従来の技術】従来は、レーザービームを使用して、硬 質ゴム・合成樹脂・木材・水牛の角など総じて硬質材を 印材とする印判を彫刻することが行われている。レーザ ーピームによる印判彫刻装置については、特公昭56-40034、57-5184、57-41343、など に開示されている。また、その彫刻方法については、特 公昭56-27388、56-40033、59-31 435、62-4231などに開示されている。

【0003】レーザービームは微細加工に適しているた 40 め、印判を彫刻するのに利用されたと考えられる。特公 昭56-40034には、印制の加工断面が凹形または 段状に彫刻することが記載されている。しかし、印材の 印面台形部分(B)のショルダーが段状であると、印判 彫刻の微細加工時、印上面からの総彫り込み深さ (a+ b) が 0.8 mmより大きい場合レーザーピームで蒸発さ せられ、発泡状の堆積物層が生じると共にレーザービー ムの熱で印材が焼けて変色層を生じ、印判の成分が印面 の凹部底隅に再度強固に堆積付着し除去が困難となる。

使用すると正常なレリーフが損傷する。そのため、印面 にレジスト膜を付着してレーザーで彫刻後、サンドブラ ストで印面を研磨する方法(特公昭56-40033) が知られている。しかしながら、これらの方法で得られ る印判の刻印形状では、この印判を使用して捺印した印 字がぼやけて満足すべきものではない。さらに加工断面 が凹形または段状では印の捺印で重要な、印上面を上か ら押し付けた時印面紋様体部分(A)を支える強度が不 足して印影が鮮明にでない。また、印面断面の凸部根元 点がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は上記の 従来の刻印形状の問題点を解決することである。すなわ ち、明瞭な印字がえられる印判および新規な刻印断面形 状を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の従来 技術の問題点を解決するため鋭意研究の結果、明瞭な印 ムの走査送りピッチの30倍以内であり、印上面からの 20 字が得られる特殊のゴム印の刻印形状を見いだし、本発 明を完成するに至った。

> 【0006】本発明のゴム印判は、レーザービームで形 成されたゴム印判であって、印判断面形状が(A)印面 の紋様幅(d)と同一の断面幅を有する印面紋様保持部 分、(B) 該(A) 印面紋様保持部分を支える印面台形 部分、および(C)印判基底部分、からなり、該(B) 部分のショルダーはスロープ状であり、そのベースの広 がり(e)がレーザービームの走査送りピッチの30倍 以内であり、印上面からの浮き彫り深さ(a)と総彫り 30 込み深さ (a+b) との比率が、1:99~99:1で あり、印判基底部分の厚み(c)は、印材幅(a+b+ c) の20~90%であることを特徴とする。

【0007】本発明のゴム印判刻印形状は、(A) 印面 の紋様幅(d)と同一の断面幅を有する印面紋様保持部 分、(B) 該(A) 印面紋様保持部分を支える印面台形 部分、および(C)印料基底部分、からなる断面形状を 有し、印面かど湾曲部分(g)の深さがりに近く、該 (B) 部分のショルダーはスロープ状であり、そのベー スの広がり(e)がレーザービームの走査送りピッチの 30倍以内であり、印上面からの浮き彫り深さ (a) と 総彫り込み深さ (a + b) との比率が、1:99~9 9:1であり、印判基底部分の厚み(c)は、印材幅 (a+b+c) の20~90%でありレーザービームで 形成されたことを特徴とする。

【0008】本発明のゴム印判レリーフの刻印形状にお ける(A)印面紋様体部分の断面は、正方形もしくは矩 形状(図1のA部分)であるが、それが図3 (a) のよ うに二つあるいは複数になってもよい。また、印面かど 湾曲部分(s)の深さ(t)の値はゴム材質により異な これら堆積物層や変色層を除去するために金属ブラシを 50 るが従来のゴム印の半分以下の値であり0.05㎜以

下、0.02 皿以下、0.01 皿以下など非常に小さい のが特徴である。また、(B) の印面台形部分の断面 は、広い意味の梯形状である。そのペースの広がり (e) は、レーザービームの走査送りビッチに比例し、 具体的には、0.02~15mが好ましい。(e)の寸 法は広くとることによって印上面のたわみ、変形を防止 することができる。

【0009】本発明に係る印判断面形状における印上面 からの浮き彫り深さ(a)と総彫り込み深さ(a+b) との比率は、1:99~99:1であるが、好ましく 1:10、より好ましくは1:3.5である。印材幅 (a+b+c) は、特に限定しないが、 $2\sim10$ mmが好 ましい。総彫り込み深さ (a+b) は、通常0.2~1 5 mmである。浮き彫り深さ (a) は、大きく取ることに よって、特に紋様内側を深く彫り込むことができ印影も 良好である。彫り深さは材質、硬度によって異なるが、 0.1~10mが好ましい。

【0010】本発明の印判のゴム印材の選択は、その素 材、硬度、厚さにおいて広範囲に可能であり、天然ゴ 質ゴムなど使用可能で各種印材に適応した材料を選ぶこ とができ好ましい。硬度は20~90°である。本発明 のゴム印判に用いるゴム印材の原料ゴムとしては、天然 ゴム、スチレン、ブタジエンラバー(SBR)、アクリ ルニトリル・プタジエン共重合ゴム(NBR)などがあ げられる。通常、原料ゴム100重量部に対してフィラ -50~150、好ましくは50~100重量部の配合 でゴム印材が造られる。架橋促進剤1~2、硫黄1~ 3、可塑剤0~10の重量比で構成されている。フィラ ーとしては、胡粉(貝殻)、クレイ、炭酸カルシウム、 タルク(ケイ酸マグネシウム)などをあげることができ

【0011】本発明の印判のレーザー加工による彫刻部 の形成の方法、すなわち印字面の形成の方法は、まず、 写植、構成して印字パターンの原稿を作製し、つぎにこ の印字パターンをスキャニング、イメージスキャナーに よりデーター処理し、そのデーターに基づきゴム印材に 直接レーザー光を照射してパターンを彫刻する。操作は コンピューターにより処理する。所定のゴム印材幅(a + b + c) に加工されたゴム甲材を円筒ドラムに巻きつ 40 け、該ドラムを回転させて、レーザービームはドラムの 軸芯に添って垂直に走査する。円筒ドラムの周速は15

SBR

華倫亜

ステアリン酸

ジベンゾチアジルジスルフィド テトラメチルチウラムモノスルフィド

苗施

フィラー (クレイ)

フィラー(胡粉)

0~220cm/s、走査ピッチは25~50 μが実用で 使用しうる範囲である。該ドラムの周速が遅いとゴム板 に照射される単位時間のエネルギーが増し、印面からの 彫りの深さがより深くなり、実用的でなく、また加工時 間を要し、ガス、電気の消費なども著しく増える。周速 が速いと生産性、経済性は良いが、彫り深さが足りなく 印影の鮮明さに欠ける。通常レーザー光は炭酸ガスレー ザーが使用され、強度は50~1200W、スポットの 大きさは50~100 μ である。

【0012】ゴム印判はスタンプインキを印面(印紋様 面) fに付着し、書類などに押圧して捺印する。捺印時 は、印面fと書類面などの捺印対象物が接触し、印面紋 様保持部分(A)の加圧圧縮によって捺印対象物にイン キが転写される。本発明のゴム印判は彫り込み部以外は レーザー光が照射されず未加工である。そのため表面が 素材のま、安定している。インキを含有する多孔質ゴム 性の浸透印はその素材の特性を生かした加工ができ、後 のインキ流出量の制御し易くできる大きな利点がある。 浸透印の場合、多孔質ゴム材にインキが含有しており、 ム、SBR系、2層又はスタビライザー付きゴム、多孔 20 加圧圧縮によってインキが押し出される。そのため、ゴ ム印字を上から押しつける力によって印影に大きく影響 する。従来の印判の断面は図2(b)のように台形状で あるが、本発明のゴム印判の断面は図2(a)のよう に、矩形断面である。そのため紋様幅(d)の捺印をす るとき、図2 (b) の従来の印判では印面かど湾曲部分 の深さtが大きく紋様幅(d)を得るためには大きな圧 縮力が必要であるが、本発明のゴム印判 (図2 (a)) では印面かど湾曲部分の探さtが0に近いので、従来よ り極めて少ない圧縮力でよい。それ故に本発明のゴム印 判はインキの消費量も少なく、一度のインキ付着で捺印 回数を多くすることができる。また、捺印された紋様幅 は圧縮力に関係なく一定となるためにばらつきが少な い。たとえば、ロ(くち)という文字の印面をとってみ ると図3 (a) が本発明の印制の印面と断面、(b) が 従来の印判の印面と断面である。

[0013]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定され るものではない。

【0014】実施例1

a) 下記の配合によりゴム印材用のゴム板(厚さ2.8 ㎜)を加工した。

100重量部

5重量部

1 重量部

1重量部

0. 2重量部 1. 2 重量部

50萬量部

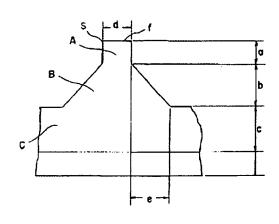
50重量部

【0015】b) 印材幅2.8 mmの該ゴム印材を円筒ド ラムの全周に巻き付ける。コンピュータ制御による操作 で該円筒ドラムの周速を190cm/s、走査ピッチを4 0μ とし、印上面からの彫り込み深さ(a)と(a+ b) とをそれぞれ印材幅の18%と48%、ベースの広 がり(e)を0.56mの加工条件を設定した。

- c) 上記条件で円筒ドラムを回転させ、ゴム印材にレー ザーを照射してパターンを彫刻した。レーザービームは その円筒ドラムの軸芯にそって直角に走査した。 レー ザーの条件は、炭酸ガスレーザーを使用し、強さ400 10 W、スポットの大きさ80μで行った。
- d) ゴム印材をレーザー加工すると刻印部におけるゴム 配合成分の大半は揮散するが、一部は残留物として刻印 部の凹部に目詰りとしてのこる。これをアルカリ処理を 行いつべいて自動洗浄機で5分洗浄し、ゴム印判を製作 した。
- 【0016】e)加工後のゴム印判の刻印形状における (A) 断面紋様体部分の断面は、正方形で、印上面から の彫り込み深さ (a) は0.5mmで、(a+b) は1. 35mmである。また、(B)の印面台形部分の断面は、 (A) より幅の広いスロープ状のショルダーとなる。印 判基底部分の厚み (c) は、印材幅2.8mmに対し1. 45㎜であった。
- f) ゴム印判は把手に貼着しゴム印とした。

[0017]

【図1】



【発明の効果】本発明の印制の断面は矩形であり、印面 かど湾曲部分の深さが0に近いため、従来より少ない加 圧で捺印できる。またインキ消費量が少なく、一度のイ ンキ付着で数多くの捺印が可能である。また捺印された 紋様幅のばらつきが少ない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のゴム印判の断面図。

- 【図2】本発明のゴム印判 (a) と従来のゴム印判 (b) との相違。
- 【図3】口(くち)という文字の刻印形状、断面形状の 相違。

【符号の説明】

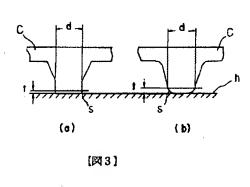
- A 印面紋様保持部分
- B 印面台形部分
- C 印判基底部分
- D 把手台
- a 浮き彫り深さ

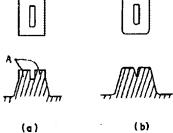
(a+b) 総彫り込み深さ

(a+b+c) 印材幅

- d 紋様幅
 - e 印面台形部分の広がり
 - f 印面 (印杖様面)
 - s 印面かど湾曲部分
 - h 捺印对象物
 - t 印面かど湾曲部分の深さ

【図2】





(b)